京都大学大学院エネルギー科学研究科

国際先端エネルギー科学研究教育センター共同利用設備の利用に関する要項

（令和４年７月１日センター長裁定制定）

（趣旨）

第１条　この要項は、国際先端エネルギー科学研究教育センター（以下「センター」という。）の共同利用スペースに設置する共同利用設備群（以下「センター共同利用設備」という。）の利用について、必要な事項を定めるものとする。

（設備）

第２条　センター共同利用設備は、別表に掲げる設備とする。

（利用者の資格）

第３条　センター共同利用設備を利用できる者は、次の各号に該当するものとする。

　（１）本学の教職員

　（２）本学の学生

　（３）その他センター長が認めた者

（管理責任者）

第４条　センター共同利用設備の適正な利用および管理を図るため、管理責任者を置き、センター長をもって当てる。

（機器責任者）

第５条　センター共同利用設備の適正な利用を図るため、各設備に機器責任者を置き、センター長が指名する。

（利用申請）

第６条　センター共同利用設備の利用を希望する者は、本要項の定めるところに従い、京都大学大学院エネルギー科学研究科国際先端エネルギー科学研究教育センター共同利用設備利用申込書（様式１）(以下「申込書」という。)を提出し、管理責任者の許可を得なければならない。

２　申込書は、利用を開始しようとする日の６ヶ月前から１０日前までに、センター事務担当（エネルギー科学研究科総務掛）に提出しなければならない。

３　利用期間満了後に継続して利用を希望する場合は、利用期間満了の１０日前までに申込書をセンター事務担当に提出すること。

（利用者の厳守事項）

第７条　利用者は、センター共同利用設備の利用に関し、管理責任者によって定められた各設備の使用上の詳細な規則（以下「使用規則」という。）ならびに本要項に掲げる事項を遵守しなければならない。

２　利用者は、操作手順の教育および単独操作に関し、使用規則に掲げる事項を遵守しなければならない。

３　利用者は、センター共同利用設備を利用の都度、利用に関する情報を使用記録簿等に記載しなければならない。

４　利用者は、機器の異常に気づいたときは速やかに機器責任者に届け出て、その指示に従わなければならない。

（利用の停止）

第８条　管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合、センター共同利用設備の利用許可を取り消し、もしくは利用を停止させることができる。

　（１）利用者が、本要項もしくは使用規則に違反し、または違反する恐れがあると管理責任者が認める場合

　（２）利用申請などの利用前情報に虚偽があった場合

　（３）使用記録簿などの利用中および利用後情報に虚偽があった場合

　（４）センター共同利用設備の管理上の事由により、利用に支障があると管理責任者が認める場合

（原状回復）

第９条　利用者が利用を終了した際は、利用したセンター共同利用設備を速やかに原状回復するとともに、機器責任者の検査・確認を受けなければならない。ただし、機器責任者が不要と認めた際は、この限りではない。

（損害賠償）

第10条　利用者は、その責に帰すべき事由によりセンターの機器、施設等に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。

（その他）

第11条　この要項に定めるもののほか、センター共同利用設備に関し必要な事項はセンター長が定める。

　　附　則

　この要項は、令和４年７月１日から施行する。

別表　センター共同利用設備一覧

(令和７年４月１日現在)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 装置番号 | 装置名・型番 | 機器責任者 |
| B002-01 | X-ray diffractometer (XRD)X’Part PRO, PANalytical | 三宅　正男　教授 |
| B002-02 | X-ray diffractometer (XRD)X’Part PRO, PANalytical | 土井　俊哉　教授 |
| B002-05 | X-ray absorption fine structure (XAFS)R-EXAFS 2000-T/F, Rigaku | 高井　茂臣　准教授 |
| B002-06 | X-ray photoelectron spectrometer (XPS)JPS-9030, JEOL | 三宅　正男　教授 |
| B002-07 | Chemisorption analyzerAutoChem Ⅱ 2920, SHIMADZU | 小川　敬也　准教授 |
| B002-08 | Scanning probe microscope (SPM)SPM-8100FM, SHIMADZU | 河本　晴雄　教授 |
| B002-09 | Zeta-potential & particle size analyzerELSZ2000ZS | 蜂谷　　寛　准教授 |
| B002-10 | Circular dichroism spectrometer (CD)J-1500 | 岡崎　　豊　助教 |
| B003-01 | Laser microscopeVK-9700, KEYENCE | 安部　正高　准教授 |
| B003-02 | Scanning electron microscopy (SEM)VE-8800, KEYENCE | 安部　正高　准教授 |
| B003-03 | Precision universal / Tensile testerAG-100kNX, SHIMADZU | 安部　正高　准教授 |
| B003-04 | Hardness testerDUH-211S, SHIMADZU | 安部　正高　准教授 |
| B003-05 | Hardness testerHMV-2TADW, SHIMADZU | 安部　正高　准教授 |
| B003-06 | Field emission scanning electron microscope (FE-SEM)SU6600, Hitachi High-Techwith EDX (XFlash 5010, Bruker) and EBSD (C-Nano+, Oxford Instruments) | 薮塚　武史　講師 |
| AESL-01 | 模擬電力系統実験設備Lab-scale simulated power system equipment | 川山　　巌　准教授 |
| AESL-02 | 3T-MRIシステム（直流電源設備を含む)3T-MRI System (with DC power supply) | 川山　　巌　准教授 |